

Результаты мониторинга измерительных потребностей предприятий nanoиндустрии (октябрь 2010 г.)

На примере проектных компаний «Роснано» в области нанофотоники:

- МВИ и СИ измерения оптических энергетических и спектральных параметров квантовых точек
- МВИ и СИ измерений параметров ВОЛС на основе фотоннокристаллических световодов
- РСИ измерений параметров светодиодной техники
- Средства поверки и калибровки СИ в области фотоприемной, оптоволоконной, светодиодной техники

Общая ориентировочная потребность в МВИ и СО - более 200

Направления программ инструментального и методического дооснащения Центра

На примере головного отделения Центра:

- Спектральные СИ различных типов для комплексирования с существующими СИ геометрических параметров в нанодиапазоне
- Лазерные и ионнолучевые системы для создания систем маркеров для позиционирования в нанодиапазоне при изготовлении мер и СО
- Комплексы пробоподготовки образцов для проведения измерений в нанодиапазоне

На примере регионального отделения в Уральском ФО:

- дифрактометр рентгеновский ДРОН-6;
- масс-спектрометр ELAN 9000;
- установка определения удельной поверхности Sorby N 4;
- средства измерений для измерения измерений насыпной плотности наноструктурированных порошков;
- тесламетр с погрешностью не более 0,01 %;
- измеритель магнитного потока с погрешностью 0,1%;
- анализатор удельной поверхности TRISTAR 3020